# ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ TISe c SmSe И НЕКОТОРЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КРИСТАЛЛОВ TISmSe<sub>2</sub>

### Ф.М.СЕИДОВ, Э.М.КЕРИМОВА, Н.З.ГАСАНОВ

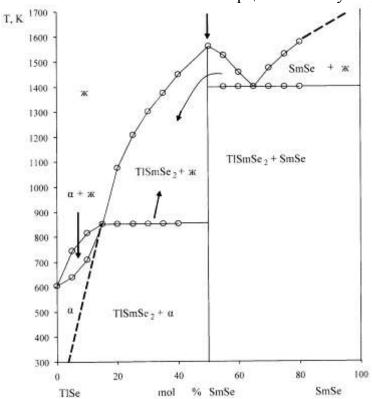
Институт Физики НАН Азербайджана AZ 1143, Баку, пр. Г.Джавида, 33

Изучение фазового равновесия в системе TISe-SmSe показало, что при соотношении компонентов 1:1 образуется соединение TISmSe $_2$  с конгруэнтным плавлением, а растворимость SmSe в TISe при комнатной температуре составляет 5мол%. В результате исследования температурной зависимости электропроводности и коэффициента Холла монокристаллов TISmSe $_2$  выявлено, что соединение TISmSe $_2$  является полупроводником р-типа. Определенная из наклона высокотемпературных участков кривых  $lgRT^{3/2}=f(10^3/T)$  и  $lg\sigma=f(10^3/T)$  ширина его запрещенной зоны составляет 0,95эВ. Установлено, что в соединении TISmSe $_2$  изменение холловской подвижности носителей тока с температурой соответствует рассеянию на акустических колебаниях решетки.

Тройные таллиевые халькогениды с редкоземельными элементами являются представителями нового класса полупроводников [1-8]. Как известно, решетка TISe составлена из двух самостоятельных структурных единиц — восьмивершинника, с ионным характером связи M-X (металл - халькогенид) ( $\mathrm{Tl}^{1+}$ -Se) и тетраэдра, с ковалентной связью между M-X ( $\mathrm{Tl}^{3+}$ -Se). Для управления полупроводниковыми свойствами при катионном замещении в рамках структурного типа практически возможным и наиболее рациональным является замещение трехвалентных ионов в тетраэдрах соответствующими элементами III<sup>B</sup> подгруппы (Ga, In), а также трехвалентными редкоземельными элементами (Sm, Yb, Dy, Gd), не затрагивая при этом одновалентных ионов в восьмивершиннике.

В связи с этим в настоящей работе было изучено фазовое равновесие в системе TlSe-SmSe и некоторые физические свойства полупроводниковых кристаллов TlSmSe<sub>2</sub>.

Образцы системы TISe-SmSe получены прямым сплавлением элементов высокой чистоты в кварцевых ампулах, вакуумирован-ных до  $1.3 \cdot 10^{-2} \Pi a$ .



при Температура печи поднималась со скоростью 5К/мин 1490÷1570K. При температуре ампула выдерживалась течение 7÷8 часов, медленно охлаждалась температуры отжига, определенной кривым дифференциальнотермического анализа (ДТА). Сплавы, содержащие В своем составе до 50мол% SmSe, отжигали при температуре 650±10К в течение 570 часов, а сплавы с концентрацией SmSe 50÷100мол% - при 1390±20К в течение 610 часов.

**Puc.1.** Диаграмма состояния системы TlSe-SmSe.

Низкотемпературную часть диаграммы состояния системы TlSe-SmSe исследовали на приборе HTP-64, высокотемпературную часть — на установке ВДТА-8, позволяющей работать до 2470К под давлением спектрально чистого гелия.

Построенная по результатам ДТА диаграмма состояния системы TlSe-SmSe показана на Puc.1. Как следует из диаграммы, в системе TlSe-SmSe при соотношении компонентов 1:1 образуется соединение TlSmSe<sub>2</sub> с конгруэнтным плавлением при температуре 1560К. Область гомогенности для данного соединения отсутствует. При комнатной температуре в TlSe растворяется 5мол% SmSe. Нонвариантная перитектическая точка отвечает составу (TlSe) $_{0,85}$ (SmSe) $_{0,15}$  и температуре 850К. Между TlSmSe<sub>2</sub> и SmSe образуется простая эвтектика состава (TlSe) $_{0,36}$ (SmSe) $_{0,64}$ , плавящаяся при температуре 1400К.

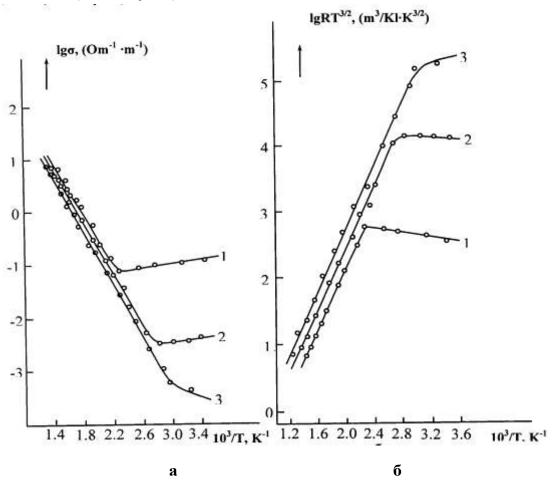
**Таблица 1.** Расчет рентгенограммы кристалла TlSmSe<sub>2.</sub>

№	I	θ	$d_{{\scriptscriptstyle {\mathfrak{I}}}\!{\scriptscriptstyle {\mathfrak{K}}}\!{\scriptscriptstyle {\mathfrak{C}}}\!{\scriptscriptstyle {\mathfrak{I}}}}}(\mathring{A})$	hkl	d <sub>pacч</sub> (Å)	Параметры элементарной ячейки
1	6	11°15'	3,844	200	3,851	
2	6	14°15'	3,126	211	3,14	
3	7	16°	2,792	220	2,789	Тетрагональная сингония
4	10	17°15'	2,595	202	2,596	a =7,682Å
5	4	20°15'	2,224	103	2,210	c =6,981Å
6	4	20°45'	2,172	222	2,170	z=4
7	7	21°51'	2,068	321	2,087	
8	4	22°54'	1,978	400	1,972	
9	4	23°36'	1,922	410	1,913	
10	4	24°30'	1,856	330	1,859	
11	6	26°30'	1,746	004	1,751	
12	10	29°	1,587	323	1,581	
13	5	31°24'	1,477	413	1,472	
14	3	32°	1,452	333	1,449	
15	3	34°	1,376	005	1,390	
16	2	35°12'	1,335	531	1,315	
17	4	36°12'	1,303	600	1,310	
18	4	37°27'	1,267	334	1,269	
19	2	38°6'	1,247	620	1,247	
20	5	40°18'	1,190	443	1,194	

Рентгенограммы порошковых образцов TISmSe<sub>2</sub> снимали на установке УРС-55 в СиК $_{\alpha}$  излучении в камере РКД-57. Результаты идентификации дебаеграммы для соединения TISmSe<sub>2</sub> представлены в Таблице 1, откуда видно, что экспериментально полученные ( $d_{\rm эксп}$ ) и рассчитанные ( $d_{\rm pacq}$ ) межплоскостные расстояния практически совпадают, и TISmSe<sub>2</sub> кристаллизуется в тетрагональной сингонии с параметрами решетки a=7,682Å; c=6,981Å; z=4.

Для исследования электрических свойств  $TISmSe_2$  были получены их монокристаллы, выращенные видоизмененным методом Бриджмена-Стокбаргера в специально изготовленных ампулах из плавленого кварца. Внутренние стенки ампулы были покрыты слоем графита. Ампулы помещали в вертикальную двухзонную печь. Равновесную температуру в верхней высокотемпературной зоне устанавливали на  $25 \div 30 \text{K}$  выше температуры плавления ( $T_{\text{пл}}$ ) вещества, а температура низкотемпературной зоны была на  $30 \div 40 \text{K}$  ниже  $T_{\text{пл}}$ . Между этими двумя зонами имелась переходная зона с градиентом температуры  $\sim 20 \text{K/см}$ .

Ампула с веществом с помощью специального механизма вводилась вдоль оси трубчатой печи в верхнюю высокотемпературную зону и после  $15 \div 20$ -часовой стабилизации режима перемещалась вниз со скоростью 0.8 мм/час. За  $7 \div 8$  дней ампула с веществом, полностью пройдя через переходную зону кристаллизации, оказывалась в низкотемпературной зоне печи. Затем, температуры обеих зон медленно (за  $2 \div 3$  суток) понижались до комнатной.



Температурная зависимость электропроводности (а) и коэффициента Холла (б) монокристаллов  $TlSmSe_2(1, 2, 3 - различные образцы)$ .

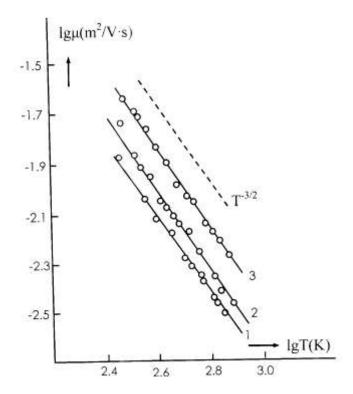
Рис.2.

Полученные таким образом слитки  $TlSmSe_2$  были составлены из ориентированных вдоль ампулы длинных ( $\sim 10$ см) тончайших волокон, образующих монолитный кристалл.

Электропроводность и коэффициент Холла  $TlSmSe_2$  исследовались компенсационным методом. Образец для измерений имел форму параллелепипеда с размерами  $(3\times4\times12)\cdot10^{-3}$ м. Для создания надежных омических контактов вольфрамовые зонды приваривались к бокам образца при помощи конденсаторного разряда.

На Рис.2 приведены температурные зависимости электропроводности и Холла монокристаллов TlSmSe<sub>2</sub>. Как видно рисунка, электропроводность увеличивается ПО мере увеличения температуры, зависимость имеет полупроводниковый  $\sigma(T)$ ДЛЯ TlSmSe<sub>2</sub> Экспоненциальный рост электро-проводности с температурой в области высоких температур связан с появлением собственной проводимости. Было определено значение ширины запрещенной зоны монокристаллов TlSmSe<sub>2</sub>, вычисленное по

наклонам высокотемпературных участков графиков  $lgRT^{3/2}=f(10^3/T)$  и  $lg\sigma=f(10^3/T)$ , оно оказалось равным 0,95эВ.



#### Рис.3.

Температурная зависимость холловской подвижности носителей тока в монокристаллах  $TlSmSe_2(1, 2, 3 -$ различные образцы).

Нами изучены также температурные зависимости холловской подвижности носителей тока кристаллов  $TlSmSe_2$ . Установлено, что изменение подвижности носителей тока с температурой (Рис.3) следует закону  $\mu$ = $f(T^{-3/2})$ , что соответствует их рассеянию на акустических колебаниях решетки.

- 1. П.Г.Рустамов, О.М.Алиев, Т.Х.Курбанов, *Тройные халькогениды* редкоземельных элементов. Баку, Элм, (1981) 120.
- 2. М.М.Зарбалиев, Неорган. материалы, 36 (2000) 619.
- 3. Э.М.Годжаев, Г.И.Зейналов, Ф.М.Годжаев, *Неорган. материалы*, **24** (1988) 215.
- 4. C.X.Агаева, М.X.Алиева, Э.М.Годжаев, *Неорган. материалы*, **29** (1993) 181.
- 5. С.Х.Агаева, Н.Г.Дарвишов, А.М.Пашаев, Fizika, ч.2 №1 (1996) 57.
- 6. С.Х.Агаева, V Респ. науч. конф. «Физико-химический анализ и неорганическое материаловедение», Баку, (1999) 68.
- 7. N.Z.Gasanov, E.M.Kerimova, Book of Abstracts. 16th International Conference on Ternary and Multinary Compounds (ICTMC-16). Technical University Berlin, Germany. September 15-19, (2008) ID-43.
- 8. Э.М.Керимова, Ю.Г.Асадов, Н.З.Гасанов, С.Б.Кязимов, *XIII Национальная конференция по росту кристаллов НКРК–2008, тезисы докладов, Москва*, 17-21 ноября, (2008) 194.

## TISe-in SmSe ILƏ QARŞILIQLI TƏSIRI VƏ TISmSe $_2$ KRISTALLARIN BƏZI FIZIKI XASSƏLƏRI

#### F.M.SEYIDOV, E.M.KƏRIMOVA, N.Z.HƏSƏNOV

TlSe-SmSe sistemində faza tarazlığının öyrənilməsi göstərdi ki, komponentlərin 1:1-ə nisbətində konqruent əriyən TlSmSe $_2$  birləşməsi əmələ gəlir, həmçinin otaq temperaturunda TlSe-in əsasında SmSe 5mol%-ə qədər həll olunur. TlSmSe $_2$  monokristallarının elektrikkeçirməsinin və Xoll əmsalının temperatur asılılıgının tədqiqi nəticəsində aşkar olunmuşdur ki, TlSmSe $_2$  birləşməsi p-tipli yarımkeçiricidir. lgRT $^{3/2}$ =f(10 $^3$ /T) və lg $\sigma$ =f(10 $^3$ /T) əyrilərinin yüksək temperatur hissələrinin mailliyindən təyin olunan qadağan zonasının eni 0,95eV təşkil edir. Müəyyən edilmişdir ki, TlSmSe $_2$  birləşməsində yük daşıyıcılarının xoll yürüklüyünün temperaturdan asılı olaraq dəyişməsi, qəfəsin akustik raqslərindən səpilməsinə uyğun gəlir.

## INTERACTION OF TISE WITH SmSe AND SOME PHYSICAL PROPERTIES OF TISmSe<sub>2</sub> CRYSTALS

### F.M.SEIDOV, E.M.KERIMOVA, N.Z.GASANOV

The study of phase equilibrium in the system of TlSe-SmSe has been showed, that with the ratio of components 1:1 the TlSmSe<sub>2</sub> compound has been formed with the congruent melting, and the solubility of SmSe in TlSe at room temperature is 5mol%. As a result of research of temperature dependence of electrical conductivity and Hall coefficient of TlSmSe<sub>2</sub> single crystals, it has been revealed, that TlSmSe<sub>2</sub> compound was the semiconductor of p-type. From the inclination of the high-temperature sections of  $lgRT^{3/2}=f(10^3/T)$  and  $lg\sigma=f(10^3/T)$  curves, hat been determined that the width of its forbidden gap is 0,95eV. It has been found that in the TlSmSe<sub>2</sub> compound the temperature dependence of the Hall mobility of current carriers corresponds to scattering at the acoustic phonons of the lattice.

Редактор: Ю.Асадов